### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-118518 (P2001-118518A)

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int.Cl.*	識別配号	FI	テーマコート*(参考)
H01J 11/02	}	H 0 1 J 11/02	B 5C027
			A 5C040
G09F 9/00	342	G09F 9/00	342 5C094
9/31	3	9/313	E 5G435
H01J 9/02	;	H01J 9/02	F
	· <b>答查說</b> 求	未請求 請求項の数16 OL	(全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平11-296318	(71)出題人 000005821 松下電器産業	蛛式会社
(22)出顧日	平成11年10月19日 (1999, 10, 19)	大阪府門真市	大字門真1006番地
		(72)発明者 高田 祐助	
			大字門真1006番地 松下電器
		<b>産業株式会社</b>	内
		(72)発明者 村井 隆一	
		大阪府門其市	7大字門真1006番地 松下電器
		產業株式会社	内
		(74)代理人 100097445	
		弁理士 岩根	文雄 (外2名)

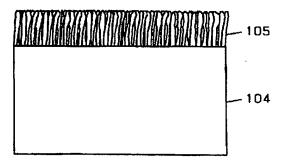
最終質に続く

## (54) [発明の名称] プラズマディスプレイパネル及びその製造方法

### (57)【要約】

【課題】 プラズマディスプレイパネルの表示性能の向上、すなわち、画像のちらつきを大幅に軽減し、発光効率の向上に寄与することを目的とする。

【解決手段】 本発明のPDPは、保護膜が、NaCl型結晶構造の<110>と<100>に配向された混晶膜を含んでいる。さらに、保護膜の結晶カラムは、膜厚方向に対して5~60度の角度をもって配向している。このような保護膜の成膜には、前者は結晶性を制御しやすいCVD法が、後者は、真空蒸着法が適している。



### 【特許請求の節囲】

【請求項1】 対向する1対の基板に挟まれたガス放電 空間に放電ガスが封入され、前記放電ガスに接するよう **に保證膜が形成されたブラズマディスプレイバネルであ** って、前記保護膜は、NaCl型結晶構造の<110> と<100>に配向された混晶膜を含むことを特徴とす るプラズマディスプレイパネル。

【請求項2】 保護膜が<110>に優先配向している ことを特徴とする請求項1記哉のプラズマディスプレイ

【 請求項3 】 保護膜中の<110>結晶と<100> 結晶の混在比[<110>/<100>]が3以上5以 下であることを特徴とする請求項1記哉のブラズマディ スプレイパネル、

【請求項4】 対向する1対の基板に挟まれたガス放電 空間に放電ガスが封入され、前記放電ガスに接するよう に保護膜が形成されたブラズマディスプレイパネルであ って、前記保護膜はNaCI型の結晶構造であり、前記 保護膜の結晶カラムが、膜厚方向に対して5~60度の 角度をもって配向しているととを特徴とするブラズマデ 20 ていくものと思われる。 ィスプレイパネル。

【請求項5】 保護膜が<1 1 0 >に優先配向していると とを特徴とする論求項4記哉のプラズマディスプレイバ ネル

【請求項6】 保護膜が<1111>に優先配向していると とを特徴とする腧求項4記哉のプラズマディスプレイバ

【請求項7】 保護膜が<100>に優先配向していると とを特徴とする請求項4記哉のブラズマディスブレイバ

【請求項8】 保護膜が<2 1 1 >に優先配向しているこ とを特徴とする請求項4記哉のプラズマディスプレイバ ネル。

【請求項9】 保護膜が<110>と<100>に優先配向 された混晶膜を含むことを特徴とする酸求項4記哉のブ ラズマティスプレイパネル。

【請求項 10】 保護膜がMg O膜であることを特徴と する闘求項1~9のいずれかに記哉のブラズマディスブ レイパネル。

【請求項11】 封入されている放電ガスのガス圧が、 300~4000Torrであることを特徴とする請求 項1~10のいずれかに記載のブラズマディスプレイバ ネル。

【請求項12】 封入されている放電ガスは、少なくと もキセノンを含むことを特徴とする前求項1~11のい ずれかに記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項13】 保護膜が、化合物の蒸気と反応ガスを 減圧ブラズマ中で分解し、反応させることで形成される ことを特徴とする睛求項1~3のいずれかに配徴のブラ ズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項14】 保護膜が真空蒸着法で形成されること を特徴とする請求項4~12のいずれかに記載のプラス マディスプレイパネルの製造方法。

【 請求項 15 】 真空蒸着法が、基板に対して蒸着物質 が斜めから入射する方法であることを特徴とする請求項 14配哉のブラズマディスプレイバネルの製造方法。

【輸求項16】 真空蒸着法が、イオンプレーティング 法である簡求項14または15に記哉のプラズマディス プレイパネルの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】 10

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ブラズマディスプ レイパネル(以下、PDPという。) 及び、PDPの保 **葭膜の形成方法に関する。** 

【0002】近年、PDPは大型フラットパネルディス ブレイの最有力と位置づけられており、また、助画表示 にも適していることから、未来のマルチメディア社会、 ディジタル技術社会のディスプレイの中心的存在であ る。今後は、より一層の高画質化、高効率化が進められ

#### [0003]

【従来の技術】従来のPDPについては、図7に示すよ うに、前面板101と背面板106とが対向されてお り、その前面板の内表面には、隣接して対となる平行な 2本の表示電極103の複数対と、この表示電極105 を被覆する低齢電体ガラスからなる膜厚40μmの誘電 体層104と、この誘電体層104の表面に保護膜10 5として8000AのMgO膜が形成されている。との MgO膜の形成方法としては、一般に、蒸着法、スパッ 30 タ法、液状の有機酸金属塩やMg Oの粉末を含むペース トを用いて塗布する方法などが用いられている。一方、 背面板106の内表面には、放電空間を区切る隔壁11 0とデータ電極108とが並行して配置され、個々の隔 壁110で区切られたセル内には、蛍光体111が塗布 されている。そして、前面板101とこの背面板106 とが対向して重ね合わされた後、その周囲が封止され、 放電空間内を排気して、キセノンが数体積%混合された ネオン混合ガスが封入されている。

【0004】さらに、最近では、隔壁間で隔離された個 40 々の放電セル間の誤放電防止、隔壁と前面板との間の振 助によるノイズ低減、内部ガス圧の増大や低気圧下での パネル膨張の防止などの目的で、隔壁の上端部に低融点 ガラスを塗布し、該低融点ガラスによって隔壁と前面板 を接合させることが提案されている(特開平5-334 956号、特開平9-259754号)。

【0005】とのようにして構成されたPDP114 は、データ電極108、表示電極103に適当なタイミ ングで電圧を印加するととにより、表示画業に相当する 隔壁110で区切られた空間部112で放電が起こり、

50 キセノンガスによる紫外線が発生する。その紫外線によ

って励起された蛍光体から可視光が放出されることによ り画像を表示されることができる。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】このPDPの表示性能 を低下させている原因としては、画像のちらつきの問題 と発光効率が低いということである。この画像のちらつ き、つまり、画質や発光効率を左右するものとしては、 放電空間に接する保護膜と放電ガスが重要な因子となっ ている。

【0007】との保護膜には、二次電子放出比ァを大き 10 くし放電開始電圧を低下させることと、寿命を長くする ために耐スパッタ性を髙くすることが要求されており、 現在のPDPでは、MgO膜が使用されるのが一般的で ある。このMgO膜は、成膜するブロセス条件により配 向性が左右され、現在のところ、放電開始電圧、耐スパ ッタ性を満足させるためには、基板に対して<111>か <110>方向に配向した膜が良いとされている(特第2 663909号や、特開平10-106441)。ま た、結晶性が高く結晶粒サイズが大きいことが優位であ は、この考えで十分であるが、表示性能、すなわち、画 像のちらつきという点では、まだ、解決されていない点 が多い。この画像のちらつきとは、放鑑が開始される助 作点電圧が微妙にふらついたり、放電遅れによって生じ ていると考えられている。

【0008】一方、発光効率については、PDPでは、 当面の課題としてあげられる。PDPの発光原理は、基 本的に蛍光灯と同様であり、グロー放電を発生させると とによりXeから紫外線を発生させ、蛍光体を励起発光 させる。しかし、との放電エネルギーの紫外線変換効率 30 や蛍光体における可視光への変換効率が低いので、蛍光 灯のように高い超度を得ることが難しく、現在のところ 最終的には可視光に利用されるのは、0.2%程度とい うことがいわれている(光学技術コンタクトV01.3 4, No. 1, P25, '96).

【0009】近年、との発光効率の向上に対して様々な 取り組みがなされている。たとえば、アルゴンーネオン -キセノンの3成分の混合ガスを用いる(特公平5-5 1133号)、ヘリウムーネオンーキセノンの3成分の スの組成を工夫する試みがなされているが、これらの発 光効率は1.11m/W程度であって十分な効果が得ら れていないのが現状である。

【0010】本発明は、これらPDPとしての表示性能 の向上、すなわち、画像のちらつきを大幅に軽減した り、発光効率の向上に寄与することを目的とするもので ある。

### [0011]

【課題を解決するための手段】との目的を達成するため に、本発明の第1の発明は、対向する1対の基板に挟ま 50 なく、画像のちらつきをも改善することができる。とこ

れたガス放電空間に放電ガスが封入され、前記放電ガス に接するように保護膜が形成されたプラズマディスプレ イパネルであって、前記保護膜は、NaCI型結晶構造 の<1 1 0 >と<1 0 0 >に配向された混晶膜を含むことを 特徴としている。通常、保護膜としては、Mg〇膜が一 般的であることは述べたが、このNaCl型結晶構造を 持つ保護膜は通常成膜するプロセス条件や下地の影響を 受けやすく、<111>, <110>, <100>などに配向 された膜が成長する。この配向を一方向に限らず、<1 10>と<100>の二方向に配向した結晶が混在する保 麓膜にすることにより、効率を飛躍的に高めることがで きた。さらに、この保護膜を用いガス圧をあげていくと その効果はさらに高まる。

【0012】従来のPDPでは、放電に伴って発生する 紫外線は、共鳴線(中心波長147nm)が大部分であ るのに対して、放電ガス圧が高い場合(すなわち、放電 空間内に封入されている原子の数が多い場合)は、分子 線(中心波長154nm,172nm)の割合が多くな る。ととで、共鳴線は自己吸収があるのに対し、分子線 ると考えられている。放電開始電圧を下げるという点で 20 は自己吸収がほとんどない。このことで、蛍光体層に照 射される紫外線の量が低下しないためガス圧が低い場合 に比べ輝度が向上し、その結果、発光効率が向上する。 【0013】本願発明者らは、このガス圧を高めたとき に、放電ガスに接する保護膜のMgO膜が一方向に配向 した膜でなく、<1 1 0>と<1 0 0>の混晶膜の方が効率 が促れていることを発見した。この理由については明ら かではないが、恐らく、分子根の割合が多くなったの か、放電モードが変化し、無効な電流が流れなくなった ためと考えられるが、実際のところは、定かではない。 また、放電ガス中のキセノン比率を適度に選択すること により放電開始電圧や効率をさらに向上させることもで きる。ガス圧は300~4000Torrの範囲で有効 であった。ととで、二方向に配向した保護膜は<110> に優先配向していることが好ましい。 さらには、保護膜 中の<110>結晶と<100>結晶の混在比[<110>/ <100>] が3以上5以下であることが好ましい。 【0014】また、本発明の第2の発明は、対向する1 対の基板に挟まれたガス放電空間に放電ガスが封入さ れ、前配放電ガスに接するように保護膜が形成されたブ 混合ガスを用いる(特許2616538号)など放電ガ 40 ラズマディスプレイパネルであって、前配保護膜はNa CI型結晶構造であり、前配保護膜の結晶カラムは、膜 厚方向に対して5~60度の角度をもって配向している ことを特徴としている。 通常Mg OなどのNaC 1型結 晶構造を持つ膜は、結晶カラムが図5に示すように、膜 厚方向に成長し、垂直配向することが知られているが、 この結晶カラムを膜厚方向に対して一定の角度を持たせ るととで保護膜の二次電子放出比ァ値をさらに高くする ことができ、さらに、放電遅れを大幅に改善することが

できる。との結果、放電開始電圧を低くすることだけで

で、保護膜は<110>、<111>、<100>、<211> に優先配向されているととが好ましい。また、<110> と<100>に仅先配向された混晶膜であることが好まし い。また、ガス圧は300~4000Torrの筬囲が 好ましい。

【0015】また、本発明の第3の発明は、第1の発明 において構成された保護膜が化合物の蒸気と反応ガスを 減圧プラズマ中で分解し反応させることで形成される方 法(以下、CVD法という)を用いて形成することを特 タ法では、試料の成膜温度や成膜速度を変えれば制御す ることは可能であるが、実際に、プロセス前後の熱履歴 の問題を考慮すると、成膜温度を400℃前後のままで 混晶膜を作製するのは、ほとんど困難である。反面、C VD法では、ガス流量などを変えることによって成膜温 度をほとんど変更することなく、<110>と<100>の 二方向の結晶性膜を混在させた膜を作製することができ る.

【0016】また、本発明の第4の発明は、第2の発明 において構成された保護膜が真空蒸着法を用いて形成す 20 ることを特徴とするPDPの製造方法である。二方向の 結晶膜を混在させるような制御は困嫌であるが、蒸着分 子を基板に斜めから入射させるなどの簡単な工夫をする ことにより、膜厚方向に対して結晶カラムに一定の傾き を持たせることができる。

### [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明のブラズマディスプ レイパネル及び、保護膜の形成方法に係る実施形態を図 面に基づいて説明する。

[0018] (発明の実施の形態1)図1は、本発明に 30 おけるPDPの主要部を示す図。図2は、本発明におけ る保護膜形成装置の概要図。図3は、本発明の実施の形 態lに係わるPDPの保護膜断面の概要図。図5は、比 較例1 に係わる従来法で形成した保護膜の断面概要図で ある。

【0019】本発明のPDPは図1に示すように、縦2 00mm機300mm厚さ3mmの前面ガラス102上 に、銀ペースト (例えば、ノリタケ製NP-4028) を膜厚5 μm、幅80μmのライン状に印刷、焼成し、 表示電極103を形成する。次に、この表示電極103 を覆うように有機パインダー(10%のエチルセルロー スを含むα-タービネール)を含む75軍鼠%のPh O、15 望星%のB2O3、10 重量%のSiO2からな る鉛系の酵気体層用ペーストをスクリーン印刷法で印刷 後・焼成し、膜厚40μmの欝電体層を得る。この欝電 体層上にCVD法により、結晶粒径が40~50nmに なるように酸素流量を調整しながら成膜する。

【0020】とのCVD法について詳細に説明する。ま ず、前面ガラス102を図2に示すような装置内にセッ

化器にはマグネシウムアセチルアセトナート (Mg (C , H, O, ), )を入れ、220℃に加熱しておく。そし て、原料ガス供給パルブおよびキャリアガス供給パルブ を開け、原料ガス供給口119から50sccmの窒素 ガスをMg(acac)。蒸気となった原料ガスととも に成膜室116に導入する。 同時に、酸素供給バルブを 開け、酸素ガス供給口120から反応ガスとしての酸素 (流量500sccm)も同様に成膜室116に導入す る。次に、高周波電源121より13.56MHzの高 徴とするPDPの製造方法である。真空蒸着法やスパッ(10)周波電界を1.2kW印加し、電極122上にプラズマ 123を発生させ、図3に示すような3000人の膜厚 で<110>と<100>との膜面内比が4:1である混晶 したMgO膜を得る。ことで、面内比とは、JCPDS に記載の値とXRD結果より得られたフィッティングカ ーブの面積との積で求められる値の比である。成膜時の 圧力は、0.08 Torrである。このようにして、前 面板ガラスが完成する。

> 【0021】一方、前面ガラス102上に銀ペースト (例えばノリタケ製NP-4028) を、膜厚5 μm、 幅80μmのライン状に印刷、焼成し、データ電極10 8を得る。次に、ガラスペースト(例えばノリタケ製N P-7973) を、膜厚20μmで印刷、焼成し、誘電 体層109を得る。さらに、この誘電体層109上にデ ータ電極108と互いに並行になるようにスクリーン版 によって多層印刷し、焼成して隔壁110を得る。との 隔壁110によって形成された放電空間に蛍光体111 を印刷し、焼成することで背面板が完成する。

> 【0022】この前面板101と背面板106を対向さ せて重ね合わせ、内部を真空に排気し、ネオンが95体 積%、キセノンが5体積%の混合ガスを500Torr になるまで封入し、PDP114を完成させる。

【0023】 このPDPのセルサイズは、0.3×0. 9mmである。

【0024】(比較例1) 本発明の実施の形態1と同様 のPDPを作製した。ただし、保護膜については同じC VD法で<110>配向のMgO膜を形成した(図5)。 膜厚は実施の形態1と同じ3000人である。

【0025】(比較例2)本発明の実施の形態1と同様 のPDPを作製した。ただし、保護膜については同じC 40 VD法で<100>配向のMgO膜を形成した。 膜厚は実 施の形態1と同じ300人である。

【0026】(比較例3)本発明の実施の形態]と同様 のPDPを作製した。ただし、保護膜については従来法 である電子ビーム蒸替によるMgO膜(<111>配向) を形成した。膜厚は実施の形態 1 と同じ3000 Aであ

【0027】本実施例と比較例1、2、3で作製したP DPを同じ動作回路で表示させたととろ、(表1)の結 果となった。この結果より、本発明のPDPは従来のP トし、基板加熱ランプ117で350°Cに加熱する。気 50 DPに比べ、優れた表示性能を示していることがわか

7

る。 [0028]

\*【表1】

# 表示性能比較

	実施の形態1	比較例1	比較例2	比較例3 (従来法)
画像のちらつき * 1	レベル2	レベル3	レベル2	レベル3
輝度	480cd/m <sup>2</sup>	430cd/m <sup>2</sup>	415cd/m <sup>2</sup>	390cd/m <sup>3</sup>
放電開始電圧	205V	190V	178V	181V
効率	1.61lm/W	1.11lm/W	1.03lm/W	0.89lm/W

\*1…画像のちらつきはテストパターン信号を入力したときの検査者の目視評価。

レベル1…ちらつき無し。

レベル2…ややちらつき有り。

レベル3…ちらつき有り。

レベル4…ちらつき多い。

レベル5…表示不能。

### ※放電ガス圧: 500Torr

【0029】なお、本発明の実施の形態1では、MgO 膜を<110>と<100>との混晶比を4としたが、成膜 条件をかえて検討した結果、3以上5以下にすると効率 が顕著に向上することがわかった。したがって、混在比 は、好ましくは、3以上、5以下である。

【0030】また、本実施の形態1では、MgO膜の膜 厚を3000人としたが、必要なのは放電空間に接する 保護膜の表面状態であり、したがって、膜厚はこの限り 30 ではない。

【0031】また、本実施の形態1では、保護膜の成膜 法としてCVD法を用いたが、作製条件によっては、従 来からの蒸着法やスパッタ法、あるいは、その他の成膜 法でも可能である。しかし、膜厚、試料温度等の制約条 件を満足するには、CVD法が好ましい。

【0032】(発明の実施の形態2)本発明のPDP は、本実施の形態1と同様に、縦200mm横300m m厚さ3mmの前面ガラス102上に、銀ペースト(例 えば、ノリタケ製NP-4028)を膜厚5μm、幅8 40 0μmのライン状に印刷、焼成し、表示電極103を形 成する。次に、との表示電極103を覆うように有機パ インダー(10%のエチルセルロースを含むα-タービ ネール)を含む75重量%のPbO、15重量%のB. O」、10重量%のSiO」からなる鉛系の誘電体層用べ ーストをスクリーン印刷法で印刷後・焼成し、膜厚40 μmの誘電体層104を得る。この誘電体層104上に 電子ビーム真空蒸着法により、<1111>方位の結晶カラ ムが膜厚方向に対して30度角度を持ったMgO膜を形 成し、保護膜105を得る(図6)。との真空蒸着法で 50 (表2)の結果となった。との結果より、本発明のPD

は、Mg Oの蒸発物が膜形成させる基板に対して30度 の入射角をもたせた。とのようにして前面板101が完

【0033】一方、背面板106の作製についても実施 の形態1と同様に作製する。この前面板101と背面板 106を対向させて重ね合わせる。このとき、放電ガス として封入するガス圧を大気圧よりも高く設定するた め、背面板の隔壁110と前面板の保護膜105を低融 点ガラスの接合部材115(例えば、旭硝子ASF-2 000)で接合する(図4)。この接合部材115は、 隔壁110上に印刷を使って形成する。そして、最後 に、放電空間を排気し、ネオンが95体積%、キセノン が5体積%の混合ガスを1500Torrまで封入し、 PDP114を完成させる。 このPDPのセルサイズ は、0.3×0.9mmである。

【0034】(比較例4)本発明の実施の形態2と同様 のパネルを作製した。ただし、保護膜については従来法 である電子ビーム蒸着による<1 1 1 >垂直配向のMgO 膜を形成した。膜厚は実施の形態2と同じ3000Aで

【0035】(比較例5)本発明の実施の形態2と同様 のパネルを作製した。ただし、保護膜については従来法 である電子ビーム蒸着による<110>垂直配向のMgO 膜を形成した。膜厚は実施の形態2と同じ3000点で

【0036】とのようにして本実施例と比較例3、4で 作製したPDPを同じ動作回路で表示させたととろ、

10

9

Pは従来のPDPに比べ優れた表示性能を示していると \* [0037] とがわかる。 \* 【表2】

#### 表示性能比較

	実施の形態2	比較例3 (從来法)	比較例4 (従来法)
画像のちらつき * 1	レベル1	V~113	レベル3
輝度	487cd/m²	877cd/m²	383od/m²
放電開始電圧	185V	206V	194V
効率	1.72lm/W	0.92tm/W	1.02lm/W

+1…関係のちらつきはテストパターン信号を入力したときの検査者の目視評価。

レベルハーちらつき無し。 レベル2…ややちらつき有り。

レベル3…ちらつき有り。 レベルル・ちらつき多い。

レベル5…表示不能。

**※放電ガス圧: 1500Torr** 

【0038】なお、本実施の形態2では、Mg〇膜の膜 保護膜の表面の結晶状態であり、したがって、膜厚はと の限りではない。

【0039】また、本実施の形態2では、放電ガス圧を 1500Torrとしたが、300Torrを越えると ころから紫外線発生量が多くなり、その結果、効率向上 が期待できる。また、ガス圧力を高くするとさらに効果 が期待できるが、放電開始電圧が実用以上の電圧とな り、パネルとしても作製困難となるため、好ましくは、 600~4000Torrである。

カラムの角度を膜厚方向に対して30度としたが、角度 を変えて検討した結果、60度を越えると画像のちらつ きが多くなるばかりか、成膜レートが極端に落ち、パネ ル内での膜厚均一性も問題となるため、好ましい角度 は、5~60度である。

【0041】また、本実施例では、保護膜の成膜法とし て真空蒸着法を用いたが、イオンブレーティング法を用 いれば、膜構造や配向性を更にコントロールすることが できる。また、成膜方法を工夫すれば、CVD法やスパ ッタ法等でも結晶カラムを傾けて成膜することができ る.

【0042】なお、本実施例では、保護膜をMgO膜と したが、二次電子放出比が高く、かつ、膜が結晶性を示 すものであって、結晶粒径を制御できる膜であれば、同 じ効果が得られることは言うまでもない。その他のNa C1型結晶構造としては、たとえば、MgF2、Ca O、SrO、BaO、Y2O3、ランタノイド類などがあ る.

[0043]

【発明の効果】以上のように、本発明では、対向する1 50 を示す図

対の基板に挟まれたガス放電空間に放電ガスが封入さ 厚を3000人としたが、必要なのは放電空間に接する 20 れ、前記放電ガスに接するように保護膜が形成されたブ ラズマディスプレイパネルであって、前記保護膜は、N aC1型結晶構造の<110>と<100>に配向された混 晶膜とすることで、放電効率を飛躍的に高めることがで きる。

【0044】さらに、本発明では、保護膜をNaC1型 結晶構造の<1 1 0 >と<1 0 0 >に配向された混晶膜とす るために、化合物の蒸気と反応ガスを減圧プラズマ中で 分解し反応させる方法、すなわち、CVD法を用いると とにより、この<110>と<100>混晶膜の比率を所定 [0040]なお、本実施の形態2では、保護膜の結晶 30 の比率に制御することができ、放電効率の高いPDPを 提供することができる。

> 【0045】また、本発明では、対向する1対の基板に 挟まれたガス放電空間に放電ガスが封入され、前記放電 ガスに接するように保護膜が形成されたプラズマディス プレイパネルにおいて、前記保護膜はNaC1型結晶構 造であり、前配保護膜の結晶カラムは、膜厚方向に対し て5~60度の角度をもって配向することにより、放電 効率の向上ばかりでなく、画像のちらつきに影響を及ぼ す放電遅れを大幅に改善することができる。さらに、結 晶カラムが一定の角度を持った保護膜を作製する際に、 蒸発物質の斜め入射による真空蒸着法を用いることによ り、放電効率が高く、画像のちらつきの少ないPDPを 提供するととができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明におけるPDPの主要部を示す図

【図2】本発明における保護膜形成装置の概要図

【図3】本発明の実施の形態1 に係わるPDPの保護膜 断面の概要図

【図4】本発明の実施の形態2に係わるPDPの主要部

12

【図5】	比較例1に係わる従来法で形成したPDPの保
	可の概要図
【図6】	本発明の実施の形態2 に係わるPDPの保護時

【図6】本発明の実施の形態2に係わるPDPの保護膜 断面の概要図

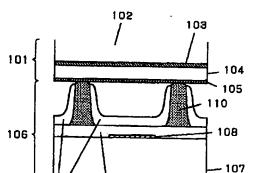
【図7】従来のPDPを示す概要図

# 【符号の説明】

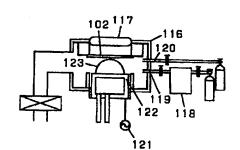
- 101 前面板
- 102 前面ガラス
- 103 表示電極
- 104 誘電体層
- 105 保護膜
- 106 背面板
- 107 背面ガラス
- 108 データ電極

111

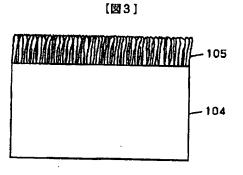
- \*109 背面板誘電体
  - 110 隔壁
  - 111 蛍光体
  - 112 空間部
  - 114 PDPパネル
  - 115 接合部材
  - 116 成膜室
  - 117 基板加熱ランプ
  - 118 気化器
- 10 119 原料ガス供給口
  - 120 酸素ガス供給口
  - 121 高周波電源
  - 122 電極
- \* 123 ブラズマ



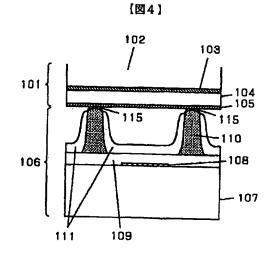
【図1】



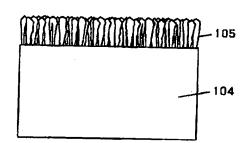
【図2】



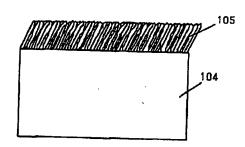
109



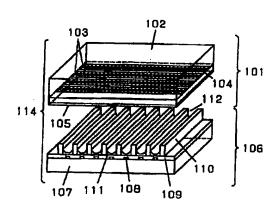
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(51)Int.C1.7

識別記号

HO1J 11/00

(72)発明者 塩川 晃

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

FI HOIJ 11/00

テマコード (参考)

Fターム(参考) 5C027 AA07

5C040 FA01 GE01 GE09 GJ02 GJ08

JA07 KB08 KB19 KB28 MA03

MA10 MA17 MA21 MA24

5C094 AA10 AA16 AA55 BA31 CA19

DA13 FB02 FB05 GB01 JA20

5G435 AA01 AA03 BB06 HH01 KK05